# 科学研究費助成事業

- . . . . . . . . .

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):磁気共鳴画像診断の造影剤として期待される鉄内包フラーレンを生成すると同時に単 離する新しい技術を開発するため,フェロセン終端チオール自己組織化単分子膜(Fe-thiol-SAM)へのフラーレン イオン散乱における散乱粒子の質量分析実験を行った。Fe-thiol-SAMを吸着した二枚の円筒凹凸レンズ及び二枚 の平板レンズの隙間にフラーレンイオンビームを入射し,散乱粒子の質量分析を行った結果,鉄原子とフラーレ ン分子の結合イオンを検出した。さらに,その粒子を単結晶シリコン基板に堆積し,誘導結合プラズマ元素分析 を行った結果,鉄原子を検出した。以上の結果より,鉄と結合したフラーレン分子の合成に成功した。

研究成果の概要(英文):We performed a mass-spectrometric study of particles scattered from the surface of ferrocene-thiol self-assembled monolayer (Fe-thiol-SAM) in the presence of fullerene ions. We aimed to develop a novel technique by which we could synthesize and then separate out endohedral iron-fullerene molecules which we postulate to be used as contrast agents in magnetic resonance imaging. We succeeded in detecting iron-fullerene composite ions via mass-spectrometry. We applied this technique to the particles scattered when beams of energetic fullerene ion entered a gap between two cylindrical glass lenses covered with the Fe-thiol-SAMs. Furthermore, iron atoms were successfully detected on the iron-fullerene composite layer deposited on the surfaces of single crystals of silicon. We concluded that we had indeed achieved the synthesis of metallofullerenes via combining fullerene with iron atoms.

研究分野: 原子分子物理学, 表面物理学

キーワード: 鉄内包フラーレン イオン表面散乱 フラーレンイオン フェロセン 自己組織化単分子膜

#### 1.研究開始当初の背景

(1)フラーレン分子は炭素骨格の中空分子 であり、その内側に異なる原子を閉じ込めた、 いわゆる内包状態を実現することができる. このような原子内包フラーレンは,医療,情 報,エネルギー分野における新しい材料とし て期待されており,効率のよい内包技術の開 発が嘱望されている.例えば,放射性同位体 内包フラーレン(RI@C60 等)は細胞単位のが ん治療を可能にするドラッグデリバリーシ ステム(DDS)として,鉄・ニッケル・コバル ト等の磁性金属原子内包フラーレン(M@C60 等)は磁気共鳴画像診断(MRI)の造影剤とし て,窒素原子内包フラーレン(N@C60等)は量 子コンピューターの分子素子として,希ガス 原子内包フラーレン(R@C60 等)は高温超電導 材料として,その高効率生成法の研究が世界 中で活発に行われている,原子内包フラーレ ンの生成にはいくつかの方法があり,主にレ ーザー蒸発法,気体接触法,分子手術法,プ ラズマ法,原子注入法がある.レーザー蒸発 法は, グラファイトと内包原子を含む混合物 にレーザーを照射し,フラーレン分子の生成 と原子内包を同時に行う方法であり,他の方 法に比べてプロセスが単純だが,生成効率が 悪く, 内包フラーレンの単離が困難であると いう欠点を持つ.他の四つの方法は全てフラ ーレン分子生成後に対象原子を内包する二 段階のプロセスを必要とするが、レーザー蒸 発法に比べて内包効率は高い.特に,プラズ マ法と原子注入法は重元素に対する内包効 率が高いことから,近年注目されている. プラズマ法では,フラーレン分子と対象原子 をイオン化し,これを磁場中に閉じ込めるた め,多数回衝突による効率的な内包が引き起 こされる.生成された原子内包フラーレンは 質量と電荷を選別した状態で固体表面上に 堆積するため,単離に有利である.その一方 で,プラズマ粒子同士の様々な衝突も避けら れないため,分子解離や結合反応が内包効率 を制限してしまう.原子注入法では,フラー レン分子を蒸着した固体表面に,対象原子の イオンビームや高エネルギー反跳核を入射 することにより内包を行う.この方法では, 内包対象原子が高密度の粒子ビームとして 高密度に堆積したフラーレン分子に衝突す るため, 内包確率が高い. その一方で, 内包 フラーレンと非内包フラーレンが混在して 固体表面上に堆積するので,単離が困難であ ,原子注入法 る.プラズマ法では窒素原子 では放射性同位元素(Na, Zn, Ge 等)の内包 が報告されているが , Fe, Co, Ni 等磁性金属 原子の内包に成功したという報告はない。 (2)以上のような学術的背景の下,研究代 表者はプラズマ法と原子注入法の利点を併 せ持つ新たな方法を考案した.すなわち,プ ラズマ法の長所である多数回衝突と,原子注 入法の長所である高密度衝突の両方を実現

する曲面間チャネル入射法とも呼べる方法

である.

2.研究の目的

本研究の目的は,鉄原子含有自己組織化単 分子膜を吸着した二対の固体表面間の峡ギ ャップ(以降,面間チャネルと呼ぶ)に C<sub>60</sub> フラーレンイオンビームを入射することに より,鉄原子とフラーレン分子との低エネル ギーの多数回すれすれ角衝突を実現し,磁性 金属原子内包フラーレン分子の高効率生成 法を開発することである.





#### 3.研究の方法

(1)本研究では,図1及び図2に示すよう に,C60フラーレンイオンビームを,フェロ センで終端されたチオール自己組織化単分 子膜を吸着したガラス製の円筒面チャネル (図2(a))または平板くさび型チャネル(図 2(b))に入射し,チャネル内での多重散乱を 経て出射した粒子の質量電荷比を「その場測 定」すると共に,それらを単結晶シリコン基 板に堆積した膜の元素分析を行った.





円筒面チャネルと平板くさび型チャネルは どちらも入射穴を通る 2 軸の周りに回転でき, フラーレンイオンビーム軸に対して任意の 角度  $\theta$  にチルトさせることができる.



図3 質量電荷比の「その場」測定の模式図

これらのチャネルを通過した粒子に対する 質量電荷比の「その場測定」を行うため,図 3 のような実験装置を用いた.出射イオンの 質量mと価数 qの比(質量電荷比)は,外部 電場 Eppによる変位 y と飛行時間 T を測定す ることにより,(1)式から求めることができる.

$$\frac{m}{q} = \frac{eLE_{PP}}{y} \left(\frac{L}{2} + \ell_5\right) \left(\frac{T - \frac{\ell_1 + \ell_2}{v_0}}{\ell_3 + \ell_4 + \ell_5 + L}\right)^2$$
(1)

ここで, ν<sub>0</sub>は入射イオンの速さである.なお, チャネルを出射した粒子の変位 x と y は二次 元位置敏感型イオン検出器(MCP-PSD)で測 定した.

(2)一方,円筒面間チャネルまたは平板く さび型チャネルを出射した粒子を単結晶シ リコン基板に堆積した後,誘導結合プラズマ 質量分析法(ICP-MS)により,元素分析を行っ た.その場合,図3における平行平板電極と チャネル出口の間にシリコン基板を設置し た.シリコン基板には正のバイアス電圧を印 加することにより,チャネル出射イオンを減 速できるようにした.

(3)フラーレンイオンビームは東洋大学バ イオ・ナノエレクトロニクス研究センターの バイオナノECRISビームライン(図4)により 生成した.ECRISから引出した4.8keVの C60<sup>+</sup>及びC60<sup>2+</sup>イオンを質量選別磁石により 90度偏向させると共に,2組のアインツェル レンズにより集束し,衝突真空槽内に導入した.真空槽内の残留気体圧力は1.0×10<sup>-6</sup> Pa 以下程度である.



4.研究成果

(1)チャネル通過粒子に対する質量電荷比

# の「その場測定」の結果

4.8 keVの C<sub>60</sub><sup>2+</sup>イオンを円筒面チャネルと 平板くさび型チャネルに入射した際のチャ ネル通過粒子に対する検出位置 *xy* 画像と価 数 *q* 分布をそれぞれ,図5と図6に示す.



図 5 円筒面チャネルへの  $C_{60}^{2+}$ イオン入 射時のチャネル通過粒子に対する(a)xy 画 像 ( $\theta = 0^{\circ}, E_{PP} = 0$  V/cm), (b) xy 画像 ( $\theta = -2^{\circ}, E_{PP} = 112$  V/cm), (c)価数 q 分布 ( $\theta = -2^{\circ}, E_{PP} = 112$  V/cm)



図 6 平板くさび型チャネルへの  $C_{60}^{2+}$ イオン入射時のチャネル通過粒子に対する (a)xy 画像( $\theta = 0^\circ$ ,  $E_{PP} = 0$  V/cm), (b) xy 画 像( $\theta = 0^\circ$ ,  $E_{PP} = 112$  V/cm), (c)価数 q 分布 ( $\theta = 0^\circ$ ,  $E_{PP} = 112$  V/cm)

(a)はチルト角  $\theta = 0^{\circ}$  で平行平板電極の電場 *E*<sub>PP</sub> = 0 V/cm の時に, チャネルを通過した粒 子の到達位置をカラーマップで表示した図 である.これに対し,(b)はチルト角  $\theta = 0^{\circ}$ または-2°で平行平板電極の電場 Epp = 112 V/cm の時に,チャネルを通過した粒子の到 達位置をカラーマップで表示した図である. (a)に比べて,電場により+y方向に変位する と共に3つのスポットに分裂した様子がはっ きりと分かる.この3つのスポットへの分裂 はチャネル通過粒子の価数に起因するもの であり,(c)はその価数分布を表している.大 多数は2価イオンであるが,5%程度は1価 イオンに、3%程度が中性であることが分かっ た.図5では,円筒面チャネルを入射ビーム 軸に対してわずかに傾けることにより,入射 イオンとチャネル内壁との衝突が顕著にな った結果,チャネル通過粒子の価数変化が大 きくなった.この傾向は平板くさび型チャネ ルでも見られた、どちらのチャネルでも、価 数 q に応じて分布がはっきりと分離したため, 以降の分析に於いて,(1)式の質量電荷比 m/q に上述の価数 q を代入することにより, 質量 m分布を求めることが可能になった.

次に,チャネル通過粒子の飛行時間 T分布 の結果,変位 y,飛行時間 T,及び上記の価 数 q を(1)式に代入することにより求めた質 量 m 分布の結果を,それぞれ図 7 と図 8 に 示す.図7は円筒面チャネル,図8は平板く さび型チャネルで,どちらも,(a)は飛行時間 T分布,(b)は質量 m分布である.



図 7 4.8 keV の C<sub>60</sub><sup>2+</sup>イオンを円筒面チャ ネルに入射した時のチャネル通過粒子の (a)飛行時間分布と(b)質量分布



図8 4.8 keVのC60<sup>2+</sup>イオンを平板くさび 型チャネルに入射した時のチャネル通過 粒子の(a)飛行時間分布と(b)質量分布

1価イオン(青)は,2価イオン(赤)に 比べて飛行時間分布の立ち上がりがやや遅 く,m<100uの解離断片イオンや500u<m <600uの小さめのサイズのフラーレンイオ ン種が生成された.これは,チャネル内壁で 生じた電荷交換衝突がフラーレン分子の炭 素間結合の切断に寄与したためであると考 えられる.これに対し,2価イオンは電荷交 換衝突を起こさない弾性的衝突が支配的に 起こったため,クラスターサイズの大きな変 化は生じなかったと考えられる.

円筒面間チャネルも平板くさび型チャネ ルも,2価イオンの主な成分は入射イオンと 同じ C602+イオンであるが、その分布は両者と もにクラスターサイズの大きい側に長く裾 を引いている.このことは,チャネル内壁に 吸着しているフェロセン終端チオール分子 との衝突によりフラーレンイオンが標的の 原子・分子を取り込んで出射したことを示し ている、さらに、図8の平板くさび型チャネ ルにおいては,その質量変化はチルト角を0° (黒線)から+2°(赤線)に傾けることによ って m ~ 35 u 程度高質量側にシフトする現 象が見出された.平板くさび型チャネルの場 合(図8),平板は元来入射ビーム軸に対して 2°傾いているため,チャネル自体を2°チル トさせることにより,入射イオン全てが一方 の平板の内壁に約4°の角度で衝突すること になる.内壁と衝突せずに通過するイオンが ほとんどなくなり,かつ,入射角が2倍に増 大したため,衝突による質量の増加が顕著に なったと考えられる.高質量側への 35 uの シフトと高質量側への裾を有する質量分布 は,鉄原子を結合した(FeC60)2+を含む領域に あるため,そのような複合イオンの生成が示 唆される.以上の結果より, C602+イオンとフ ェロセン・チオール分子との衝突により (FeC<sub>60</sub>)<sup>2+</sup> 複合イオンが生成されたと考えら れる.

(2)単結晶シリコン基板への堆積膜の誘導 結合プラズマ質量分析結果

図9に,平板くさび型チャネルを通過した粒子を単結晶シリコン基板に堆積した膜の誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)結果を示す.



図 9 平板くさび型チャネルを通過した 粒子を単結晶シリコン基板に堆積した膜 の誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS) 結果

ここで,図9における「ブランク」は試料 を分析装置内に入れないときに得られた鉄 原子強度,「非堆積基板」は堆積基板と共に 衝突真空槽内に置いた非照射基板に対して 得られた鉄原子強度をそれぞれ表す.これら 二つの鉄原子強度(水色)に比べ,「堆積基 板」に対して検出された鉄原子強度(赤)は 有意に大きい.この結果から,チャネル内壁 での衝突の結果,少なくとも鉄原子を結合し た複合粒子がチャネルを通過したことが確 認された.

(1)のその場質量分析結果と(2)の堆 積膜の元素分析の結果を総合的に判断する と,フラーレン分子と鉄原子の結合したフラ ーレン・鉄複合クラスターの生成に成功した と結論できる.すなわち,本研究の目的の一 つである鉄原子とフラーレン分子との低エ ネルギーのすれすれ角衝突を実現すること に成功し,新しいフラーレン・鉄複合クラス ター分子の生成を確認した.一方,現段階で は鉄原子の内包を確認するまでには至らず, それが今後の課題である.

## < 引用文献 >

S. Biri *et al.*. **77** (2006) 03A314.
S.K. Saha *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. Phys.
Res. B **243** (2006) 277.

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

### 〔 雑誌論文〕( 計 2 件 )

<u>Kenji Motohahi</u>, Nobumasa Miyawaki, Yuichi Saitoh, Shiro Matoba, Guiding of 4MeV C<sup>+</sup> and C<sup>4+</sup> ion beams using cylindrical glass channel, Japanese Journal of Applied Physics, 査読有, Vol. 56, 2017, pp. 046301 – 1 – 046301 – 6 10.7567/JJAP.56.046301 <u>Kenji Motohahi</u>, Yuichi Saitoh, Nobumasa Miyawaki, Kazumasa Narumi, Shiro Matoba, Kinetic Energy Distribution of 4-MeV-C<sup>4+</sup> Ions Transmitted through a Curved Glass Channel, JAEA Takasaki Annual report 2014.

查読有 ,Vol. JAEA–Review 2015–022, 2016, p. 131 – 131

10.11484/jaea-review-2015-022

### [学会発表](計21件)

立川 知樹、内田 貴司、本橋 健次、フェ ロセンで覆われた C<sub>60</sub> イオンを入射した 際の出射粒子の質量分析、第64回応用物 理学会春季学術講演会、2017 年 3 月 16 日、パシフィコ横浜(神奈川県・横浜市) 石井 州、真瀬 透仁、本橋 健次、一対の 光学レンズの隙間に入射した低速多価イ オンビームの透過特性、第64回応用物理 学会春季学術講演会、2017年3月15日、 パシフィコ横浜(神奈川県・横浜市) 本橋 健次、齋藤 勇一、宮脇 信正、鳴海 - 雅、ガラス円筒面間チャネルでガイド された 4MeV-C<sup>q+</sup>イオン(q=1, 4)のエネル ギー分布、第1回QST 高崎研シンポジウ ム、2017年1月26日、量子科学技術研 究開発機構高崎量子応用研究所(群馬 県・高崎市)

<u>Takashi Uchida</u>, Synthesis and Modification of Carbon Nanostructures utilizing Plasma and Ion Beam, 2016 RBS International

Workshop on Biocompatible Nanomaterials and Nanodevices for **Bio-Medical** Applications, December 15-17, 2016, Kuala Lumpur (Malaysia) 本橋健次、立川知樹、内田貴司、フェ ロセン終端チオール自己組織化単分子膜 表面での C<sub>60</sub> イオン散乱、原子衝突学会 第41回年会、2016年12月10日、富山 大学五福キャンパス(富山県・富山市) Kenji Motohashi, Tomoki Tachikawa. Takashi Uchida, Mass spectroscopy of fullerene ions scattered on glass surfaces covered with ferrocene molecules, The 14th International Symposium on Bioscience and Nanotechnology, November 24, 2016, Kawagoe campus, Toyo University, (Japan) 立川 知樹、内田 貴司、本橋 健次、フェ ロセン終端チオール自己組織化単分子膜 表面での 4.8keV-C<sub>60</sub> イオンの散乱過程 日本物理学会 2016 年秋季大会、2016 年 9 月14日、金沢大学角間キャンパス(石川 県<br />
・<br />
金沢市) 立川 知樹、内田 貴司、本橋 健次、フェ ロセン終端チオール自己組織化単分子膜 表面での 4.8keV-C<sub>60</sub> イオンの散乱過程、 日本物理学会第71回年会、2016年3月 19日、東北学院大学泉キャンパス(宮城 県·仙台市) Takashi Uchida, Carbon nanostructures for Biomedical Imaging/sensing, First SQU International Chemistry Conference "Recent Trends in Drug Development", November 10-12, 2015, Muscat (Sultanate of Oman) 本橋 健次、齋藤 勇一、宮脇 信正、的場 史朗、鳴海一雅、円筒ガラス凹凸レンズ の面間チャネルに入射した 4MeV-C<sup>q+</sup>イ オン(q=1,4)のビームガイド効果、第 10

回高崎量子応用研究シンポジウム、2015 年10月8日、日本原子力研究開発機構高 崎量子応用研究所(群馬県・高崎市) 立川 知樹、<u>内田 貴司、本橋 健次</u>、自己 組織化単分子膜表面での 4.8-keV C<sub>60</sub><sup>2+</sup> イオン散乱による鉄原子内包の試み、原 子衝突学会第40回年会、2015年9月28 日、首都大学東京南大沢キャンパス(東

京都・八王子市) <u>本橋健次</u>、立川知樹、対向するガラス 円筒凸面と凹面の隙間に入射した 4.8-keV C<sub>60</sub><sup>q+</sup>(q=2,3)イオンの透過特性、 原子衝突学会第40回年会、2015年9月 28日、首都大学東京南大沢キャンパス(東 京都・八王子市)

<u>本橋健次</u>、立川知樹、4.8keV-C<sub>60</sub><sup>q+</sup> (q=2, 3)イオンのガラス円筒面間チャネル透過、 日本物理学会2015年秋季大会、2015年9 月16日、関西大学千里山キャンパス(大 阪府・吹田市)

<u>Takashi Uchida</u>, Richard Racz, Masayuki Muramatsu, Yushi Kato, Atsushi Kitagawa, Sandor Biri, Yoshikazu Yoshida,

Functionalisation of Fullerenes Utilizing Plasma and Ion Beam, NanoteC15 (Carbon nanoscience and Nanotechnology). September 14-17, 2015, Corpus Christi College, Oxford (UK) Takashi Uchida, Richard Racz, Masayuki Muramatsu, Yushi Kato, Atsushi Kitagawa, Biri. Yoshikazu Yoshida. Sandor Two-Chamber Configuration of Bio-Nano ECRIS for Fullerene Modification. 16th International Conference on Ion Source. August 23-28, 2015, New York (USA) Takashi Uchida, Synthsis and Modification Carbon-based Nanostructures. of International Conference on Contemporary Advances of Science & Technologies 2015, August 7-9, 2015, Varanasi (India) 本橋 健次、齋藤 勇一、宮脇 信正、的場 史朗、鈴木 優紀、円筒ガラス凹凸レンズ の面間チャネルに入射した 4MeV-C<sup>4+</sup>イ オンの透過特性、第9回高崎量子応用研 究シンポジウム、2014年10月9日、高 崎シティーギャラリー(群馬県・高崎市) Takashi Uchida, Introduction to Carbon Nanomaterials and Lectures at the Graduate School of Interdisciplinary New Science, Toyo University-JEOL Visit Programme, September 17, 2014, Sultan Qaboos University, (Sultanate of Oman) 石原聖也、内田貴司、吉田善一、鉄イ オン照射による鉄内包フラーレンの生成 と高速液体クロマトグラフィによる分析、 第 75 回応用物理学会秋季学術講演会、 2014 年 9 月 17 日、北海道大学札幌キャ ンパス(北海道・札幌市) Takashi Uchida, Introduction to Carbon Nanomaterials, 1st International Seminar on Application of Bio-Nano Technology in Medicine, September 16, 2014, Riyadh (Kingdom of Saudi Arabia) ② 本橋 健次、齋藤 勇一、宮脇 信正、的場 史 朗、鈴木 優紀、ガラス円筒凸レンズと凹 レンズの狭ギャップに入射した C<sup>4+</sup>(4MeV)イオンの透過特性、日本物理学 会 2014 年秋季大会、2014 年 9 月 8 日、中 部大学春日井キャンパス(愛知県・春日井 市) 〔図書〕(計0件) なし 〔産業財産権〕 出願状況(計1件)

出願年月日:2014年12月26日 国内外の別: 国内

取得状況(計1件)

名称:イオンビーム軌道制御装置 発明者:本橋健次 権利者:学校法人東洋大学 種類:特許 番号:第5550042号 取得年月日:2014年7月16日 国内外の別:国内

[その他]

ホームページ等

東洋大学理工学部生体医工学科教員紹介(本 橋健次)

http://ris.toyo.ac.jp/profile/ja.09d82e3d424baf42 35d89d03011450fa.html

東洋大学理工学部生体医工学科原子物理工 学研究室

http://www.toyo.ac.jp/nyushi/undergraduate/sce/d bme/laboratory/motohashi.html

東洋大学大学院学際・融合科学研究科バイ オ・ナノサイエンス融合専攻教員紹介(内田 貴司)

http://ris2.toyo.ac.jp/profile/ja.081e31a2227269e 95ed65988f8f9fc9b.html

6.研究組織

(1)研究代表者 本橋 健次 (MOTOHASHI, Kenji) 東洋大学・理工学部・教授 研究者番号:50251583

# (2)研究分担者

内田 貴司 (UCHIDA, Takashi) 東洋大学・学際・融合科学研究科・准教授 研究者番号:90470343

(3)連携研究者 なし

(4)研究協力者 なし

名称:金属原子内包フラーレン生成装置 発明者:<u>本橋健次、内田貴司</u>、吉田善一 権利者:学校法人東洋大学 種類:特許 番号:特願 2014-264024、特開 2016-124712